ボライド化合物 PrRh4.8B2 の熱伝導率測定

Thermal conductivity of a layered boride compound PrRh_{4.8}B₂

物材機構¹. 東北大金研², 国士舘大³, [○]掛札 洋平¹. 湯葢 邦夫², 宍戸 統悦², 岡田 繁³, 川本 直幸¹, 馬場 哲也¹, 森 孝雄¹

NIMS ¹, Tohoku Univ. ², Kokushikan Univ. ³, [°]Yohei Kakefuda ¹, Kunio Yubuta ², Toetsu Shishido ², Shigeru Okada ³, Naoyuki Kawamoto ¹, Tetsuya Baba ¹, Takao Mori ¹

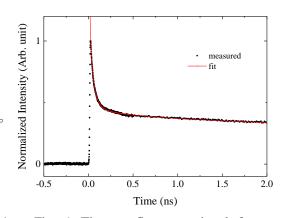
E-mail: MORI.Takao@nims.go.jp

[研究背景] 金属ホウ化物系は、磁性や超伝導など興味深い物性を示すことから注目されてきた。また、最近の研究によってボライド化合物によっては大きなゼーベック係数と比較的低い熱 伝導率を持つことが明らかになってきた。そのため、熱電変換材料として有望であると考えられている。しかし、さらなる熱電性能指数 ZT の向上のためには熱伝導率を抑制する必要がある。本研究では、特異的な層状構造を有するボライド化合物 PrRh4.8B2 に注目し、その層間方向の熱伝導率を測定した。

[実験方法] PrRh4.8B2 単結晶は溶融金属フラックス法により合成した[1]。得られた結晶をガラス 基板に固定した後、スパッタ法により厚さ 100 nm の Pt 薄膜を試料表面に蒸着した。表面垂 直方向(層間方向)の熱伝導率を時間領域サーモリフレクタンス(time-domain theremoreflectance、TD-TR)法により測定した。TD-TR 測定装置はピコサーム社製 PicoTR を用いた。

[実験結果] PrRh4.8B2単結晶表面より得られたサーモリフレクタンス信号を Fig. 1 に示す。 鏡像法

による解析の結果、熱伝導率は $1.39~W/(m\cdot K)$ と 求められた。この値は、過去に報告された層状構造を持つボライド化合物 AlB_2 および α - $TmAlB_4$ [2] と比較して極めて小さい。この熱伝導率の抑制は、特異的な結晶構造に由来すると考えられる。すなわち、この化合物は、 $PrRh_3B_2$ 層のブロックに Rh 層が挿入されたような構造を取っており、透過電子顕微鏡像から、Rh 層においてランダム



に位置した原子欠損が存在することが示唆されてい Fig. 1 Thermoreflectance signal from る。この Rh 欠陥がフォノンを効率よく散乱し、フォ PrRh_{4.8}B₂. ノン伝導を抑制していると考えられる。

[1] T. Shishido, T. Mori, K. Yubata, Y. Kawazoe, K. Nakajima, J. Flux Growth 3 (2008) 61.

[2] X. J. Wang, T. Mori, I. Kuzmych-Ianchuk, Y. Michiue, K. Yubuta, T. Shishido, Y. Grin, S. Okada, D. G. Cahill, APL Mater. 2 (2014) 046113.